

# SEM ユーザーズミーティング

---

## プログラム

- 09: 30～ 受付
- 10: 00～10: 10 開会挨拶
- 10: 10～10: 40 新型 FIB-SEM JIB-PS500iの紹介  
日本電子株式会社 EP事業ユニット EPアプリケーション部 中島 雄平
- 10: 40～11: 15 地衣類中の放射性セシウムをマイクロレベルで“見る”  
～分析装置の組み合わせで実現した微小領域分析～  
日本原子力研究開発機構 土肥 輝美 様
- 11: 15～11: 45 SEMによる粒子解析に適した試料分散方法の紹介  
日本電子株式会社 EP事業ユニット EPアプリケーション部 高山 隼
- 11: 45～12: 15 昼食
- 12: 15～13: 00 実機・ポスター展示
- 13: 00～13: 30 長時間！高品質！SEM自動測定の秘訣  
日本電子株式会社 EP事業ユニット EPアプリケーション部 河野 林太郎
- 13: 30～14: 05 データ・ロボット駆動科学における計測分析機器の新しい活用法  
～新しい研究開発の進め方で研究開発を加速する～  
国立大学法人 東京大学 一杉 太郎 様
- 14: 05～14: 35 全固体電池 in-situ観察・分析の最新機種を用いた事例紹介  
～CP-SEM-EDS～  
日本電子株式会社 EP事業ユニット EP技術開発部 木村 達人  
日本電子株式会社 EX事業ユニット EX技術開発部 柳原 孝太
- 14: 35～15: 05 休憩 /実機・ポスター展示
- 15: 05～15: 40 定量的な SEM像評価の試みと低加速電圧での EDSの活用例の紹介  
ウエスタンデジタルテクノロジーズ合同会社 松村 純宏 様
- 15: 40～16: 10 信号量を増加させるためのテクニック  
～明るく観察しやすいSEM像を得るために～  
日本電子株式会社 科学・計測機器サービス事業部 サービス企画推進本部  
R & D推進部 八幡 英里香
- 16: 10～16: 20 閉会挨拶
- 16: 20～17: 30 懇親会 /実機・ポスター展示

\*プログラムは予告無く変更させていただく場合がございます。予めご了承頂きますようお願い申し上げます。